

DUAL-BEAM (MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À DOUBLE FAISCEAU)

FICHE N° 759

Période de fabrication : 2000-2024

Fabricant : FEI ; FEI ; FEI

Domaines : Physique

Sous-domaines :

Organisme : INSTITUT FRESNEL, Campus Étoile, Faculté des Sciences de Saint Jérôme, Avenue I
Niemen - 13397 MARSEILLE

Ville : Marseille

Modèle : DB 235 Strata

Matériaux :

Description

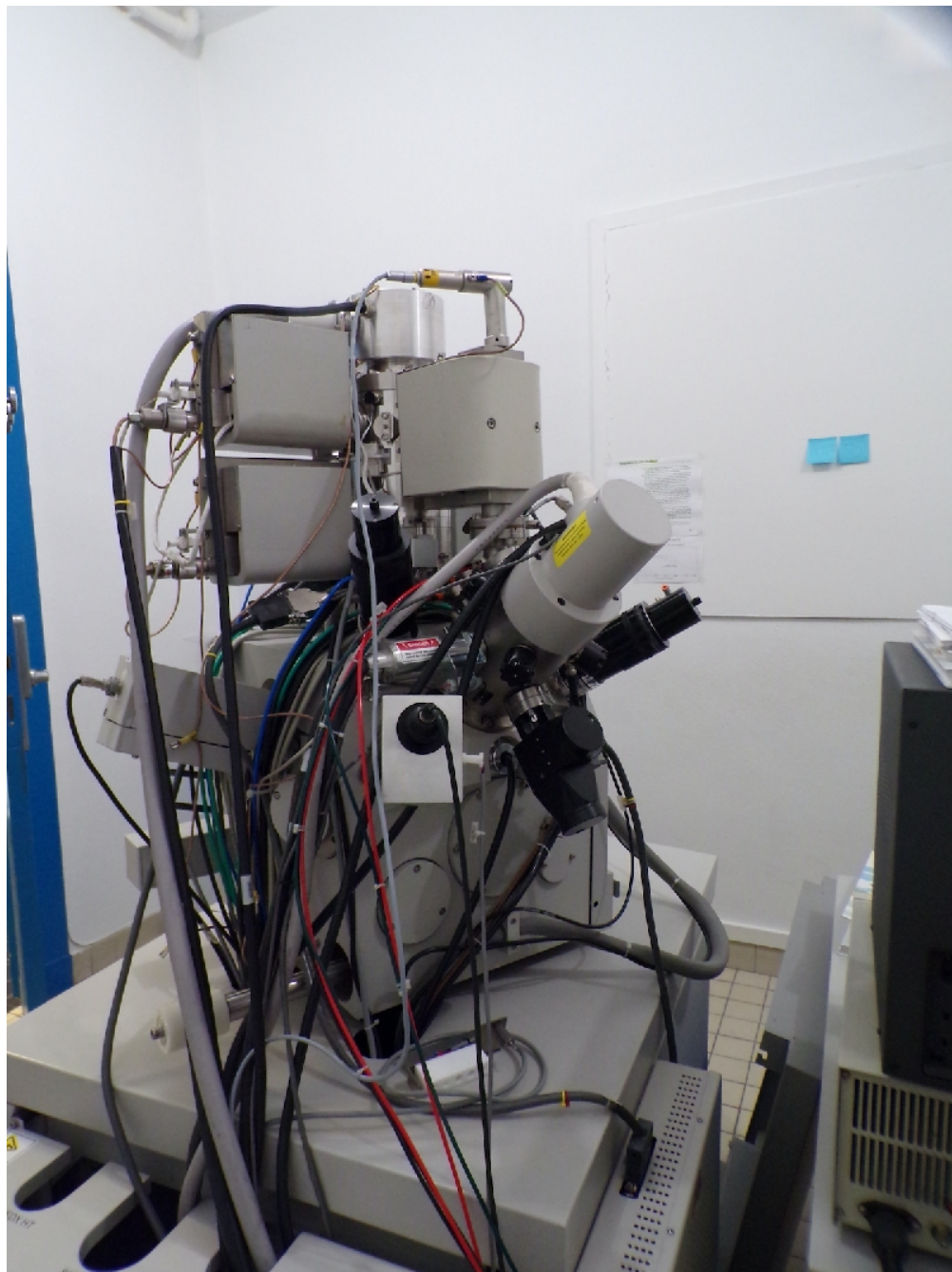
L'instrument fabriqué par la société FEI se compose d'une chambre d'analyse de 2 colonnes électroniques et ioniques pour l'imagerie par microscopie électronique et la gravure par faisceau d'ions gallium focalisé. Il s'agit d'un microscope électronique avec une source à effet de pointe fonctionnant sous vide. Une deuxième colonne sert à la source d'ions gallium focalisés. Le double microscope sert à fabriquer des structures à l'échelle nanométrique avec faisceau d'ions focalisé et à de l'imagerie non destructive avec le faisceau électronique.

Utilisation

L'objet est utilisé pour la recherche à l'Institut Fresnel.

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Dual-Beam (Microscope électronique à double faisceau) (FEI ; FEI ; FEI), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=24904>, consulté le 2026-07-28